

DPA-SDD-Pro-Mini 代表高性能的X射线硅漂移探测器，可在极低的成形时间下实现高分辨率。

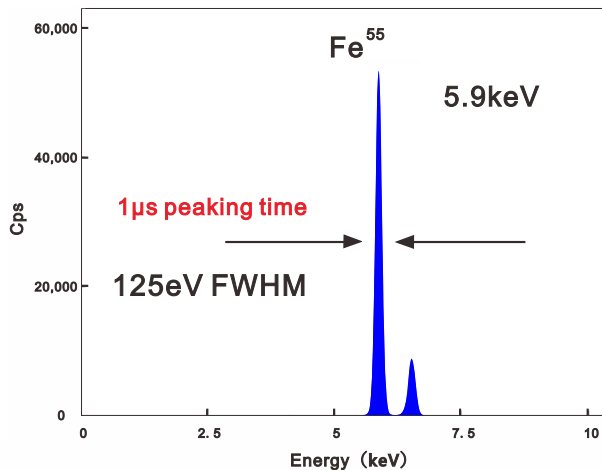
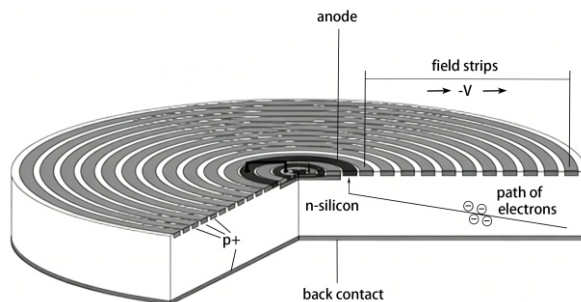
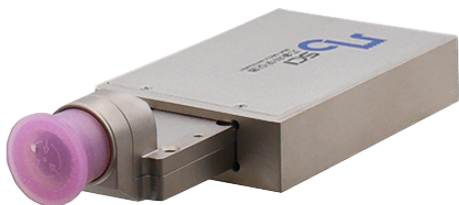


图1.SDD数字多道探测器Fe55光谱图



产品图片：



DPA-SDD-Pro-Mini (H)



DPA-SDD-Pro-Mini (O)

产品描述：

- 125eV FWHM 分辨率 @ 5.9 keV
- 峰背比: 15,000:1
- 面积: 20/30/50 mm²
- 厚度: 450 μm
- 最佳达峰时间(Max Cooling): 1μs
- 最大输入计数率: 2000KCPS
- USB接口及RS232接口
- 无需液氮制冷

产品应用：

- X-Ray Fluorescence X射线荧光光谱仪
- RoHS / WEEE Compliance XRF
- OEM 及其特殊应用
- 在线分析检测
- 科研

规格参数概述

类 型	SDD-Pro-Mini 数字多道探测器
感光面积	20mm ² / 30 mm ² / 50 mm ² （可选）
厚 度	450μm
分 辨 率 @5.9keV(Fe55)	125eV FWHM 达峰时间 1μs
峰 背 比	15,000:1
窗口厚度	1μm/8μm (Graphene/Be)
准 直 器	多内层准直器
电荷灵敏度 前置放大器	定制设计，带复位功能。
重 量	125g
电 源	4.5-9VDC
设备生存期	通常 5-10 年，视使用情况而定
保存及运输	常规保存：温度：-10℃-30℃ 湿度：10%-90%（非凝结环境下）
工作环境	0℃-50℃

DPA-SDD-Pro-Mini能够以极高的能量分辨率实现极高的计数率应用，它的高性能、小尺寸使其在X荧光光谱分析中得到广泛的应用。

准直器的使用

大多数探测器都装有内部准直器，以提高光谱质量。X射线在探测器有效区域边缘附近相互作用，可能会由于部分电荷收集而产生逃逸峰。

在某些应用中，这些逃逸峰会影响感兴趣信号。内部准直器将X射线限制在产生完整信号的有效区域内。准直器可根据探测器类型改进峰背比（P/B）、消除逃逸峰和改善准直器干扰峰。

附加系统信息和性能

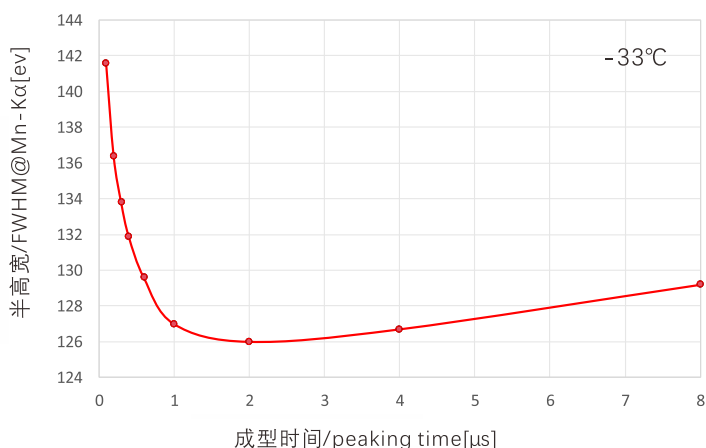


图2.分辨率与达峰时间

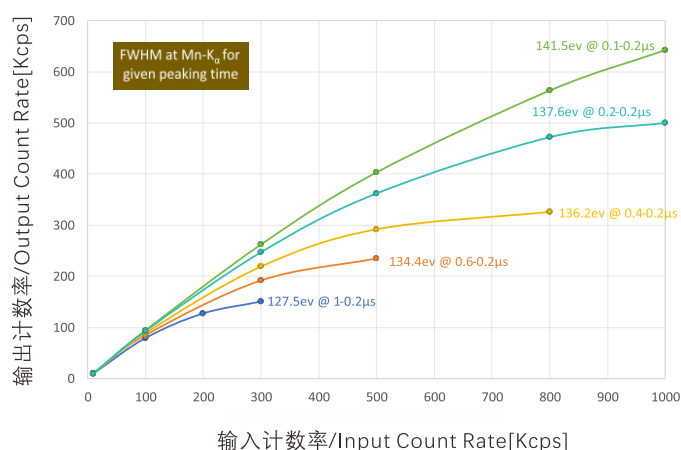


图3.计数通过率/Throughout

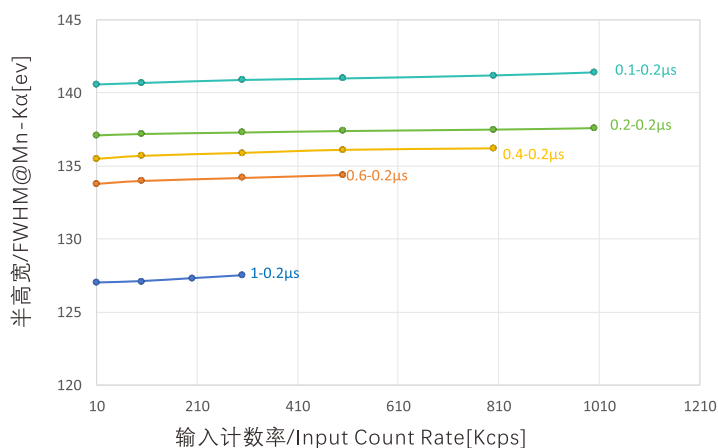


图4.计数率与分辨率

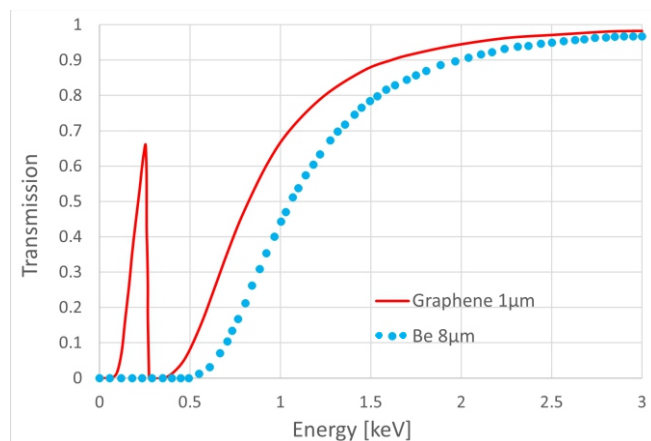
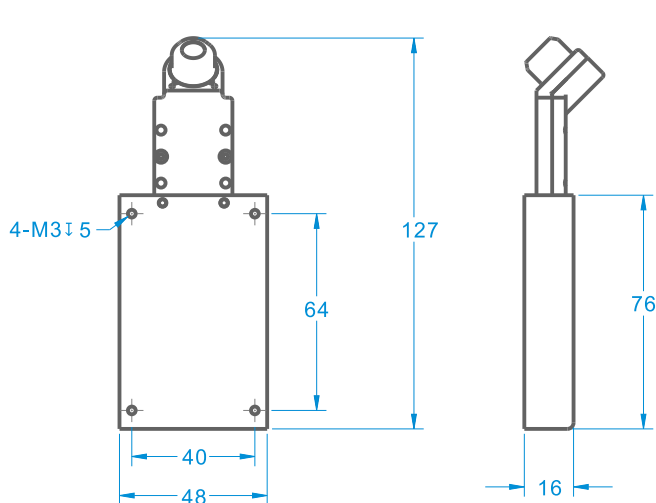
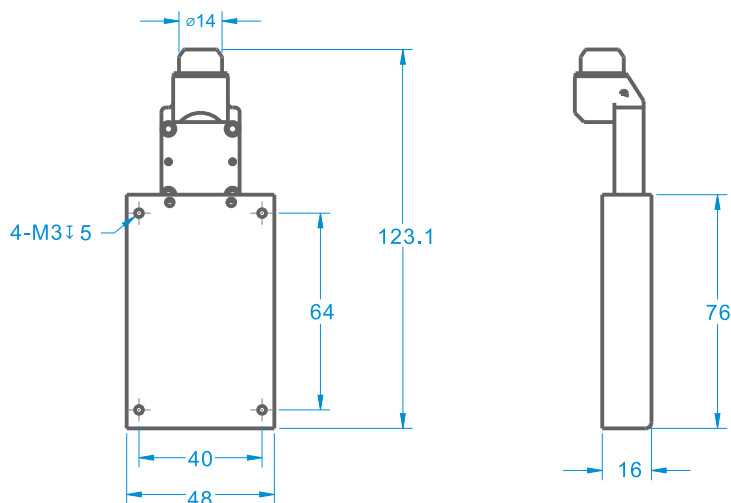


图5.探测器光窗透光率

尺寸图【单位：毫米】



DPA-SDD-Pro-Mini (O)



DPA-SDD-Pro-Mini (H)

应用谱图

